

g%Q0i j †#Ý 8 S9x(- Ø ^>1 -#ì @ Ý - %o 2 \5 “(Š Ž I b Å#Ý

An Accurate 3 -D Morphology Recovering Technique Using Binocular Parallax and Its Application for Metal Powders Morphology Analysis

2 Å(Akira Miyazima) , © Ÿ(Osamu Furukimi) g.( e µ(Fumio Saito)  
Ü • Z P (Yoshicti Uemoto)

0[ " :

(ò i b o(y S4 b0Û o †/œ : S u>\* g%Q0i j †#Ý 8 S , K 8'g / g"g Ý - m 2 †6ä\$î K S  
• m 2 b z ^"I © c>\*8• æ Ë i « 2 \_ | • P Å!l H(ô i \_ -\$x \_8• æ b ± A I † q4: i M  
• G \> | g H(ô8• æ AE b P Å M •8• æ b ± A I † • š \_ M • G \ [ 6 • X í © Ñ x p  
i © Ù å \_ | • è0! [>\*0i j \_ | • š g l b3ã ‘ ö @ f €>\* r S%& P9x l’i \_ b (0Ž+  
† ‘ ¶ 2 \_ š m 2 , ¥ V [ A • G \ †&g K S • m 2 \_ | • È ” ° Đ – ¬5r(Š b g"g0Ž Ø  
[ c>\* •#+"g i #.(Š Ž b | : ^0 7§ ^ g"g \_ > 8 Z v #Ý\$x ^(- Ø [ g"g b Ý - @/œ <>  
r S"l #5 \ K Z Ç Ü i ± Ý - †#Ý 8 • \#ì @ b , „á ^ ] b0{ 9 ² ó \_ | } N#+"g i  
#. b w!“ † 8 9 [ A • G \ @ f ? W S

Synopsis :

A new three- dimensional morphology recovery technique was developed for the analysis of material microstructures. The principal concepts embodied in the technique are dynamic optimization of the size of matching areas using area -based stereo matching and adjustment of the size of corresponding areas within the search area. Numeric

# 両眼視差を用いた高精度な 3 次元画像復元方法と 金属粉末への応用\*

川崎製鉄技報  
24 (1992) 1, 38-44

## An Accurate 3-D Morphology Recovering Technique Using Binocular Parallax and Its Application for Metal Powders Morphology Analysis

### 要旨

素材の微細構造の評価を行うため、両眼視差を用いた新しい立体

形態計算法を提案する。この方法は、複数枚の2次元写真から得られる

抽出を基盤に1)二角幾何学を用い、スケルトンの特徴ベース法の利点 太平の部位位置を部位に対応占めかねる場合があり、「ミスマッチング」と呼ばれる現象が発生する。

が有力である。

→ セグメント 対応位置における対応位置の断面の電子顕微

チング」と呼ぶ。アンマッチング、ミスマッチングが発生すると、  
相対位置が異常となるが出現する。省略する形状の誤差を検出する。

鏡観察などでは、テクスチャの存在や不定形性あるいは滑らかさの

に、両眼視差を用いた復元方法には必然的に発生する誤差要因であ

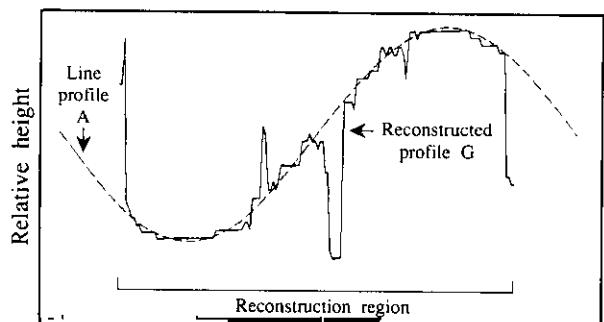
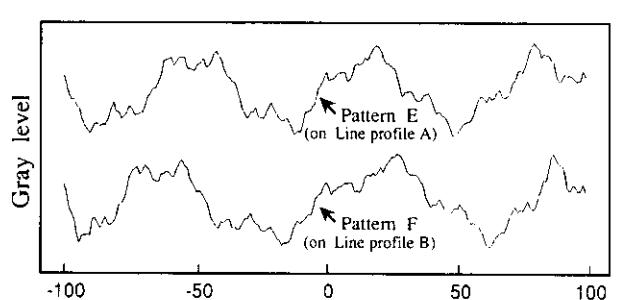


Fig. 3 Effect of quantization and discretization of gray level pattern

Relative position (pixel)

Fig. 4 Profile reconstruction by conventional method

(1)に基づいてパターンDに変化する。

$$\left. \begin{array}{l} x_d = x_e \cos \theta - y_e \sin \theta \\ G_d = G_e \end{array} \right\} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

ここで、 $x_d, G_d$ は表面濃淡パターンDのx座標、濃度である。

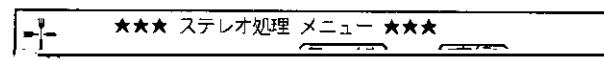
での位置のずれである。

Fig. 3 のEとFは形状はよく似ているが、x軸方向の位置のずれだけでなく、部分的にx軸方向に拡大、縮小されているのがわかる。

せる方法を開発した。すなわち設定した基準画像上の小領域に対する部分的な拡大、縮小は滑らかであり、対応点探索時の傾斜画像上の小領域サイズの選択範囲は前回の最高小領域サイズの近傍にある。

まで順次変化させ、おのおのの小領域サイズで探索領域を走査して

ことになる。よって、小領域サイズの選択範囲を絞り込め、処理



像がおののおの縦512画素、横432画素にデジタル化され、1画素

斜画像の対応する1画素ラインだけを対象にすればよいはずだが、面の抽出が必要である。厳密には表面マップの作成、平面パッチ、

小領域および探索領域で一致度の評価を行った。このため、全面に

に形状特徴量を算出する。

いる。

測定粉末数を増やして同一の解析を行うと、球状化処理粉末の $D$